

Model 1100TN

Electrostatic Force Microscope : very high spatial resolution ESVM system

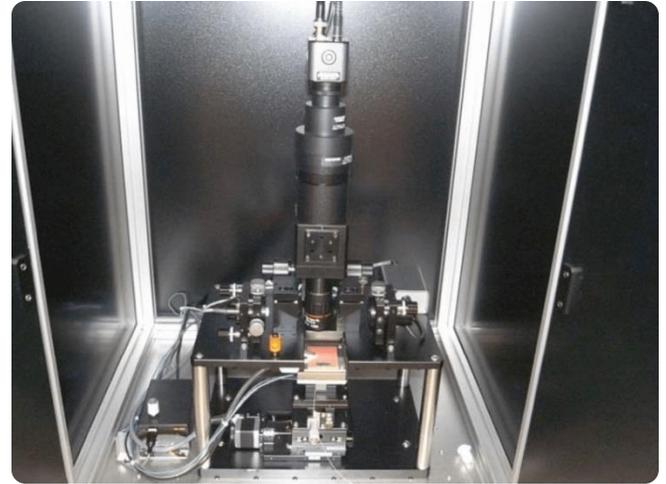
高空間分解能: 10 μ m

走査範囲: 数mm²

EFMの特徴

先端寸法5 μ m x 5 μ mのカンチレバーを有した走査型プローブ顕微鏡タイプの表面電位分布計測システムです。

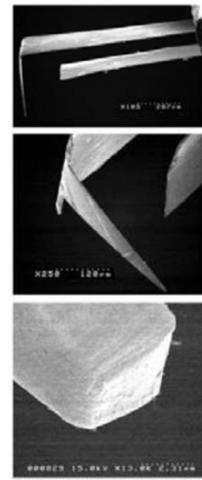
今までの表面電位計では測定出来なかった非常に細かい10 μ m程度の表面電位分布を測定する事ができ、数mm程度の非常に広いエリアの走査が可能です。 \pm 1000Vの電圧を0.5%の高精度で測定する事が出来ます。



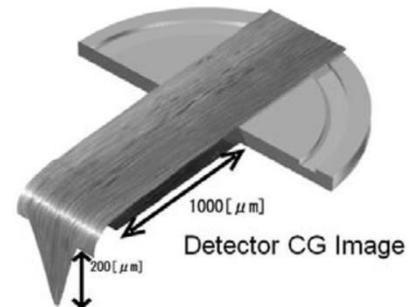
測定器外観

EFMの仕様

空間分解能:	10 μ m以下
カンチレバー先端:	5 x 5 μ m ²
測定電圧範囲:	\pm 1000V(最大 \pm 2000V)
測定電圧精度:	0.5% F.S.
測定電圧感度:	最高20mV以下
測定速度:	最高30ms/plot
走査範囲:	最大5x5mm ² 程度
走査ステップ幅:	最小1 μ m
測定モード:	定点、ライン、3D



SEM pictures of detector

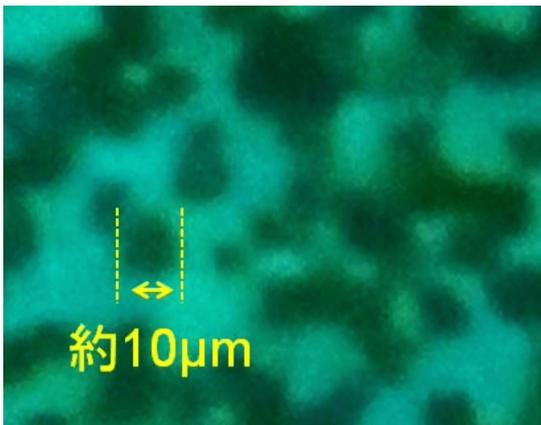


Detector CG Image

Material: Nickel with 5 μ m thickness
Detector tip size : 5 x 5 μ m²

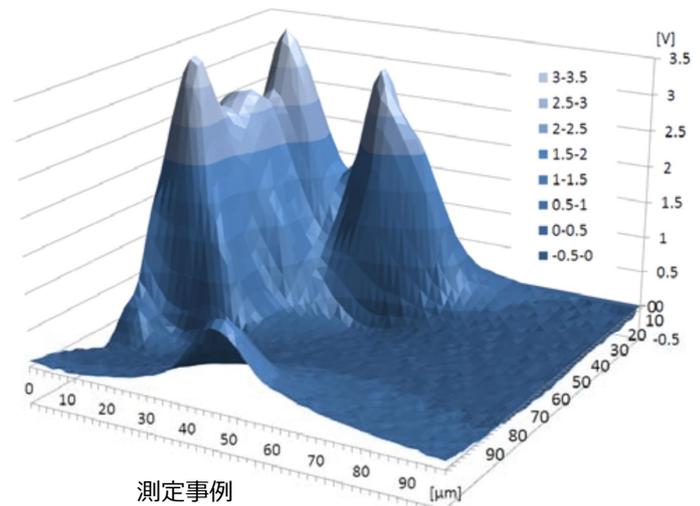
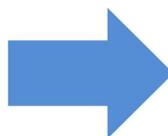
カンチレバーイメージ

EFMによる測定事例



測定サンプル (トナー) 写真

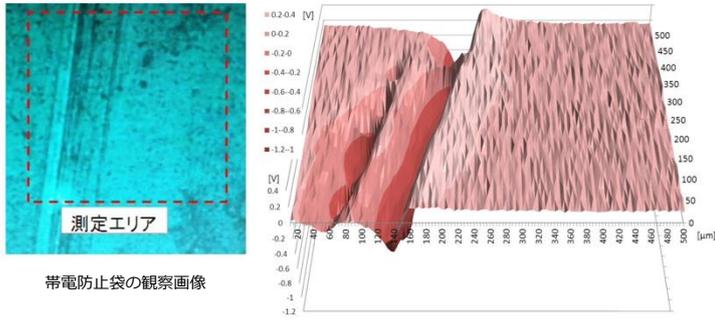
EFMで測定



測定事例

Model 1100TN

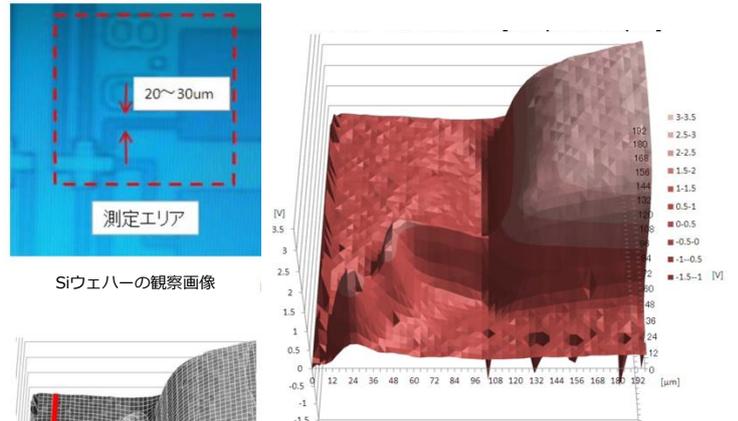
帯電防止袋の測定事例



帯電防止袋の観察画像

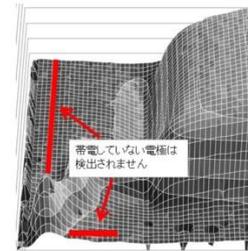
帯電防止袋の測定例 [500μm x 500μm]

Siウェハの測定事例

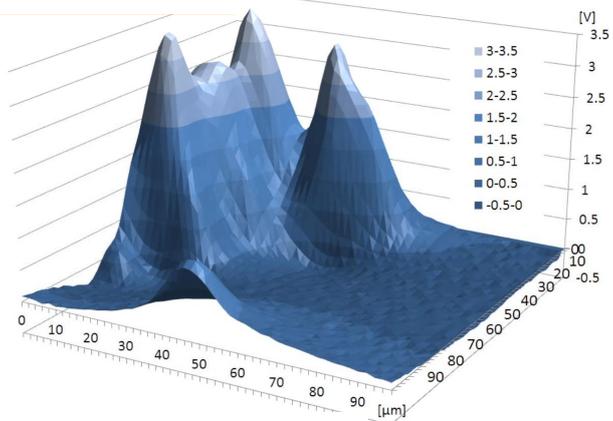


Siウェハの観察画像

Siウェハの測定例 [200μm x 200μm]

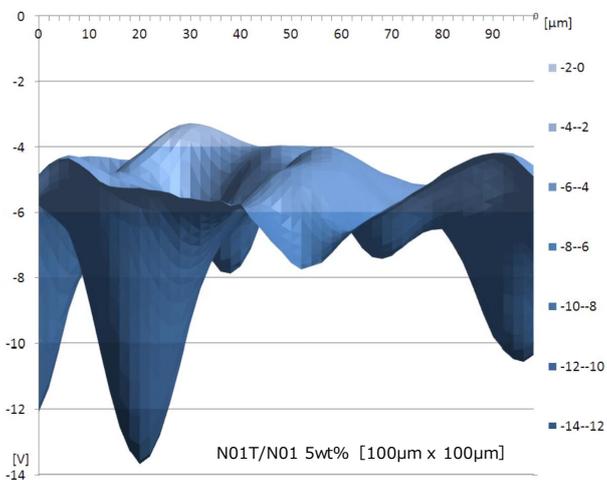
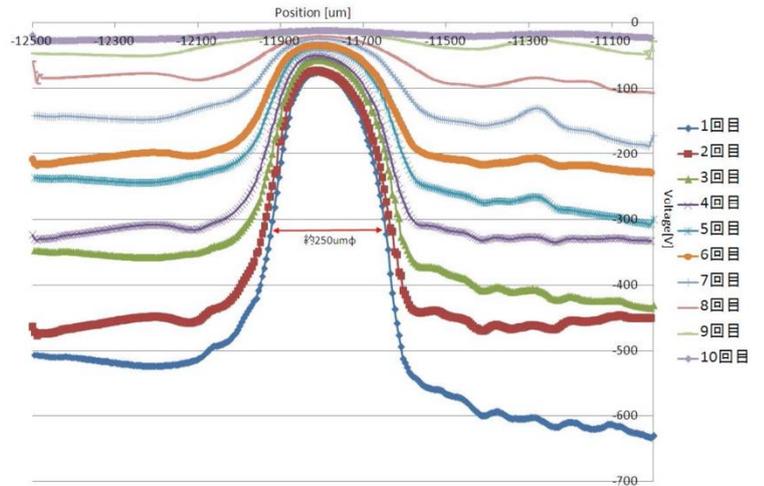


トナーの測定事例



MX/P02 5wt% [100μm x 100μm]

静電潜像の測定事例



N01T/N01 5wt% [100μm x 100μm]

本資料に記載されている情報は信頼できるデータに基づく代表的な性質の紹介であり、当社及びメーカーが次の事項について保証するものではありません。

(1) 本製品から得られる最終製品の性能
 (2) 本製品およびその情報・推奨事項に関連する有効性や安全性
 メーカー、当社およびその代理店は、本製品を使用したことによる結果・損失に関するいかなる責任も負いません。
 本製品およびその情報・推奨事項の使用・活用につきましては、お客様の責任により十分な試験を実施していただき、使用可否を決定いただきますようお願いいたします。
 最終製品における、本製品の安全性や適正については、お客様ご自身で必要な評価・分析を行っていただき、ご判断くださいますようお願いいたします。
 本資料に記載されている以外の技術情報、口頭での推奨事項などにつきましても、メーカー、当社およびその代理店は、同様にいかなる責任も負いません。



株式会社ウエストワン
<https://west-1.co.jp>
 info@west-1.co.jp